PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-179936

(43) Date of publication of application: 12.07.1990

(51)Int.CI.

G11B 7/135

G11B 7/09

(21)Application number : 63-334863

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: OKUDA MICHITAKA

ENDO TAKASHI

TOKIDA YUKIKO

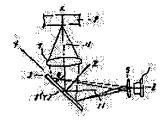
(54) OPTICAL INFORMATION REPRODUCING DEVICE

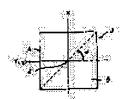
29.12.1988

(57)Abstract:

PURPOSE: To diminish errors due to positional changes of focus error signal and a tracking error signal in their spots on a photodetector even when the wavelength of a laser beam is varied due to an ambient temp. change, etc., and hence an angle of diffraction is altered by dividing a diffraction grating element into two areas with a specific straight line.

CONSTITUTION: The diffraction grating element 3 is disposed between a semiconductor laser 1 ad an objective lens 7, and the plane of the diffraction grating element 3 is arranged to be inclined at θ =45° with an optical axis 11 in the direction of an optical information recording medium 9 after passing through the objective lens 7 from the semiconductor laser 1. Then, the surface of the diffraction grating element 3 is divided into two areas A and B by, for instance, the straight line (as shown with a dotted line) inclined at 0=45°, and the individual areas A and B are formed with with interfer ence fringes shifting slightly the position of a min. blur circle of regenerative light respectively. The inclined angle α is desirable to fall within a range of $45^{\circ}~\pm 5^{\circ}~$. By this method, even when the angle of diffraction is altered by changing the wavelength of the laser light due to an ambient temp. change, etc., the errors to be generated in the focus error signal and the tracking error signal can extremely be diminished.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

(1)特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平2-179936

Sint. Cl. 5

壁別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)7月12日

G 11 B 7/135 7/09 Z 8947-5D A 2106-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

60発明の名称

光学式情報再生装置

20出 顧昭63(1988)12月29日

何発明者 英田

通 孝

東京都世田谷区玉川台2-14-9 京セラ株式会社東京用

賀事業所内

加発明者 速藤

隆 史

東京都世田谷区玉川台2-14-9 京セラ株式会社東京用

賀事業所内

60 発明者 常田 由紀子

. 東京都世田谷区玉川台 2 -14-9 京セラ株式会社東京用

賀事業所内

勿出 顋 人 京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

10代理人 弁理士 熊谷 隆

外1名

明 紹 書

1,発明の名称

光学式情報再生装置

2.特許請求の範囲

光想と、酸光類から発射された射出光を光学式 情報記録媒体上に集束させる対物レンズと、前記 光類から前記対物レンズに至る光路中に配置され 前記光線から発射された射出光を透過又は反射し て前記対物レンズに入射させるとともに前記光学 式情報記録媒体からの反射光の一部を+1次回 に回折させる回折格子素子と、該+1次回折光を それが最小館配円を結ぶ位置で検出する光検出 とを具備し、前記光学式情報記録媒体上の情報を 再生する光学式情報再生装置であって、

0次回折光の光軸と+1次回折光の光軸が成す 平面と前記回折格子素子の面が交差する直線から 前記回折格子素子と光軸が交わる点を中心に回折 格子素子上で45°±10°傾斜した直載で前記 回折格子素子を2つの領域に分割し、それぞれの 領域に再生された光の最少錯乱円の位置が若干ず れるような干渉論を形成せしめたことを特徴とする光学式情報再生装置。

3 . 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光ディスク装置。光測定器等の光学 式情報再生装置に関するものである。

〔従来の技権〕

従来、コンパクトディスク等の光ディスク内の 情報を読み出す光学式情報再生装置が開発・実用 化されている。そしてこのような光学式情報再生 装置の中には、該光ディスク内の情報の読み出し のための対物レンズの焦点制御を行なうために非 点収並法を用いている構造のものがある。

第5回はこの方法を用いた従来の光学式情報再 生装置を示す図である。

同図に示すように、この光学式情報再生装置に あっては、半事体レーザ100からの射出光は、 反射型回折格子素子101で反射され、対象レン ズ103を通ってディスク105の情報記録面1 07に祭光する。そして散情報記録面107から 反射されたピット情報は再び対物レンズ103を 通過して反射型回折格子常子101に反射され、 その0次回折光は半導体レーザ100上に集光 し、その+1次回折光109は4分割光検出器1 11上にその最少錯乱円113で集光して記録情報信号、フオーカス認識信号、トラツキング認益 信号を検出する。

ところで、この種の光学式情報再生装置に用いられる半導体レーザ100は、温度の変化によってその射出するレーザの波長が若干ではあるが変化する性質を有する。そしてレーザの波長が変化すると、回折角が変化し、4分割光検出器111上に集光する最少輸乱円113の位置が若干変化し、フォーカス製差雷号、トラッキング製差信号に製差が生じる。

この製造を補正するために、従来は例えば、回 折格子常子の表面を多数に分割し、それぞれの領 域に異なる干渉額を形成し、これらそれぞれの領 域から生ずる多数個の+1次回折光を、多数個の 光検出器を使用して検出することによって補正し

又は反射して前記対物レンズに入射させるととも に前記光学式情報記録媒体からの反射光の一部を + 1 次方向に回折させる回折格子素子と、験+1 次回折光をそれが最小錯乱円を結ぶ位置で検出する光検出器とを具備し、前記光学式情報記録媒体 上の情報を再生する光学式情報再生検置である 上の情報を再生する光学式情報再生検置である。 で、0次回折光の光軸と+1次回折光の光軸を す平面と前記回折格子素子の面が交差する直を中心 があ子素子と光軸が交わる点を中心をでか が格子素子と光軸が交わる点を中心をでか が格子素子と2つの領域に分割し、それでれ での領域に再生された光の最少錯乱円の位置が ずれるような干渉縞を形成せしめて構成した。

(作用)

上記の如く光学式情報再生装置を構成することにより、たとえ周辺温度の変化等によってレーザ、 光の被長が変動して回折角が変化しても、フォーカス観差哲号とトラッキング観益信号のスポット の光検出器上での位置の変化による観差を非常に 少なくできる。 ていた。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のような製菓の補正方法を 用いると、回折格子素子を多数の領域に分割して 干渉舗を形成する必要があるため、 歌回折格子素 子の製作が困難となり、また多数個の光検出器を 使用するため、その調整が困難となり、コストも 高くなるという問題点があった。

本発明は上述の点に鑑みてなされたものであり、レーザ波長の変化によって生ずるフォーカス 製芝信号とトラッキング製差信号の光検出器上で の製金を補正でき、しかも部品点数が少なく、そ の構造が簡単で、製造が容易な光学式情報再生装 量を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

上記問題点を解決するため本発明は光学式情報 再生装置を、光源と、敏光源から発射された射出 光を光学式情報記録媒体上に集束させる対物レン ズと、前記光源から前記対物レンズに至る光路中 に配置され前記光源から発射された射出光を透過

また、1枚の回折格子素子に2種類の干渉額を 形成するだけで、上記の製造が補正できる回折格 子素子が製作できる。

さらに光検出器は4分割光検出器1個でよいので、部品点数が少なくその構造が簡単となり、製造が容易となる。

〔 実施例 〕

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。

第1団は本発明にかかる光学式情報再生装置の 基本構造を示す図であり、同気(a)は側面図、 同図(b)は同図(a)からディスク9と対物レ ンズ7を取り除いて上からみた平面図である。

同図に示すように、この光学式情報再生装置は、反射型の回折格子素子3と半導体レーザ1と 凸レンズからなる対象レンズ7と4分割光検出器 からなる光検出器5を具備している。またここで 9は光ディスク等の光学式情報記録媒体である。

ここで、対物レンズ7は光学式情報記録媒体9 に対向する位置に配置される。 また回折格子素子 3 は半導体レーザ 1 と対物レンズ 7 の間に配置され、かつ前記半導体レーザ 1 から対物レンズ 7 を通って光学式情報記録媒体 9 に向かう光軸 1 1 に対して回折格子素子 3 の面が $\theta=4$ 5 で傾針するように配置されている。

また光検出器 5 は y - z 平面上であって前記光 動11が回折格子素子 3 と交わる点から前記光軸 11に対して 0 。だけ傾いた軸 L (+ 1 次回折光 軸) 方向であって、 + 1 次回折光が最小錯乱円と なる位置であり、且つ敵軸 L に対してその面が垂 質になるように配置されている。

ここで第2回は第1回に示す回折格子寄子3を 第1回(a)に示す+2軸方向から見た回である。

なおこの回折格子業子3を説明するために、何 図に示すようにその面がX-Y平面となるよう に、(X,Y,Z)座線を設定する。

同図に示すように、この回折格子素子 3 の表面は、 $\alpha = 4.5$ 類解した直線(同図の点線で示す)で 2 つの領域 A , B に分割され、それぞれの

の光軸 & 2 とは若干ずれる。

このため、光検出器 5 上に築光する最少値 3 円のスポットは第 3 図(α)。(α)。(α)。に示すように、 Δ ℓ 。の距離隔でて 2 つに分削された状態となる。

ここでフォーカス誤差信号は、

(R1+R3)-(R2+R4)・・・(D)とし、トラッキング製売信号は、

(R1+R4)-(R2+R3)・・・20 とする。

そして、レーザ光の波長が周囲温度の変化に よって若干変化すると、同図(a)に示すよう に、最少錯乱円のスポットの位置が矢印方向に移 動する。

しかしながら2つに分割されたスポット間には △1:の隙間があるので、放スポットがたとえ左 右方向にそれぞれ距離(△1:/2)移動して も、回折格子素子3のR1.R2.R3.R4の それぞれの仮域に限射される光量に変化はない。 これは岡因(1),(1),(c)のいずれの場 領域 A , Bには 再生光の最少館乱円の位置が若干 ずれるような干渉額がそれぞれ形成されている。

そして半導体レーザ1から発射された射出光は、回折格子素子3で反射され、垂直上方に向かい、対物レンズ7によって光学式情報記録媒体9上で集束する。そして散集束した光は散光学式情報記録媒体9で反射され、再び対物レンズ7を通過して回折格子素子3に至る。

そしてこの光は回折格子素子3で反射され、その内の0次回折光は半導体レーザ1に集光し、また+1次回折光は光検出器5上に到達し、該光検出器5によって前記光学式情報記録媒体9上の情報を電気信号に再生するとともに、フォーカス設差信号とトラッキング設差信号を検出するのである。

ここで、第1図(b)に示すように、回折格子 素子3の領域Aと領域Bのそれぞれには、それぞ れ再生光の最少錯乱円の位置が若干すれるような 干渉譲が形成されているので、A領域で反射され た再生光の光軸 £1とB領域で反射された再生光

合も同様である。

従ってスポットが移動しても上記式①、式②の フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信号に変 化は生じない。

次に本発明の回折格子紫子3を作成する方法を 試明する。

第4回は本発明にかかる回折格子素子3上に干 排験を記録する方法を示す図である。

「国団に示すように、まず回折格子素子3を (y, z)平面からy軸を中心に45°傾けた位 気に配置する。

・ 次に該回折格子素子 3 の領域 B にマスクをする。

特開平2-179936 (4)

世したレーザー光振からレーザー光を発射することにより、回折格子書子3の領域A上に干渉額を記録する。ここでこの点P。、P。に配置したレーザー光輝は点光輝であり、該光緩から発射される光は球面波となり、従って回折格子素子3上に形成される干渉額は2光東球面波の干渉によって作成されることとなる。

次に回折格子素子 3 の領域 B のマスクを取り除くとともに、領域 A にマスクを施す。

そして、y-2平面内であって z 軸から原点を中心に角度θ ι k だけ傾いた軸上であって酸原点から+ l s 離れ且つ前記点 P s からΔ l . だけ離れた点 P s (0, y * 1, z * 1)にレーザー光源(第3の点光源)を配置する。そしてこの点 P s . と前記点 P ι に配置したレーザー光源からレーザー光を発射することにより、回折格子案子3の領域 B 上に干渉績を記録する。

そして回折格子素子3の領域Aからマスクを取 り触さ、現象定着、源白等の作業を経れば、本発 明に用いる回折格子素子3が完成する。

に示す記録時のP。とP,の位置を数式で近似的 に求める方法を説明する。

・まず再生時の基準被長を入っとし、温度変化に よって変動する被長変化量を Δ 入とすれば、変化 する上下の彼長 入」、入』は、

 $\lambda_1 = \lambda_1 + \Delta \lambda$, $\lambda_1 = \lambda_2 - \Delta \lambda$

これらの値より、+1次回折光の変化するそれぞれの傾き角 θ a.i. θ a.i. (第1関参照)を近似的に求めるには、記録系と再生系には、

$$\theta_{s} = \sin^{-1}(\alpha_1 \sin \theta_1)$$

但し、μ, -λ, /λ, ί = 1, 2

λ:記録時の光の被長

入』:再生時の光の彼長

θ, : 記録時の参照光とま軸がなす角

度

どいう関係があるので、

$$\theta_{Ri} > \sin^{-1}(\mu_i \sin \theta_i)$$

但し、μ: ーλ: /λ、μ: ーλ: /λ

置したレーザー光気からレーザー光を発射するこ ここで、上記回折格子素子3に形成する干漆値 とにより、回折格子業子3の領域A上に干漆線を の式は、前記第2回に示す座標(X,Y)で示す 記録する。ここでこの点P。,P.に配置した と以下のようになる。

①低域Aにおいては、

$$\frac{\sqrt{(X + z_{01} s i n \theta)^{2} + (Y - y_{01})^{2}}}{+ (z_{01} c o s \theta)^{2}} - \sqrt{(X + z_{01} s i n \theta)^{2} + (Y)^{2}}$$

$$\frac{1}{+ (z_{01} c o s \theta)^{2}}$$

- n)

②領域Bにおいては、

$$\frac{\sqrt{(X + z_{*1} s i n \theta)^{2} + (Y - Y_{*1})^{2}}}{+ (z_{*1} c o s \theta)^{2}} + (Y - Y_{*1})^{2}}$$

$$\frac{-\sqrt{(X + z_{*1} s i n \theta)^{2} + (Y - Y_{*1})^{2}}}{+ (z_{*1} c o s \theta)^{2}}$$

= n λ

但し、

θ:第1団に示す回折格子素子3の傾斜角

入:記録時の光の彼長

n:整数

なお再生時の波長変位量△入から、前記第4図

入:記録時の光の波長

6、: 第4図に示す記録時の x 軸と、 点 P 。 と点 P 。 の中点から原点 に至る軸のなす角度

となるように θ ± 1 , θ ± 2 を定めればほぼよい。 なおこの式の意味は θ ± 1 を θ ± 1 ± 2 ± 3 ± 1 ± 3 ± 3 ± 4 ± 4

なお再生時の2つのスポットの変化距離△2: は、

 $\Delta L_{\tau} = 2 L$, tan { $(\theta_{\pi i} - \theta_{\pi i})/2$ } $\geq \pi \delta$.

そしてこの式を満足するのは、10元を、

$$\theta_{+i} = a i n^{-i} \{ (a i n \theta_{+i}) / \mu_c \}$$

但し、kcー入c/入

λ:記録時の光の被長

特開平2-179936 (5)

にそれぞれ代入すれば、近似的に θ , $_1$ と θ , $_2$ が求まる。

そしてもれとりれを、

 $\Delta \theta_1 = \theta_{11} - \theta_{12}$ に代入し、さらに敵 $\Delta \theta_1$ を、

 Δ ℓ . = Δ θ . \cdot ℓ . ϵ に代入すれば、数 Δ ℓ . が求まる。

なお上記の場合は再生時の被長変位量△入から、記録時のP。とP。の位置を求めるのに数式を用いて行なったが、このような数式を用いずに、実験によって適当に被長変位量△入から記録時のP。とP。の位置を求めてもよい。

以上本発明にかかる光学式情報再生装置の一実 施例を説明したが、本発明はこれに限られず、例 えば、

①回折格子素子3は反射型のもののみに適用されるものではなく、透過型の回折格子素子に適用 してもよい。

さらに光検出器は1個でよいので、部品点数が 少なくその構造が簡単となり、製造が容易でコス トも低気化できる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる光学式情報再生装置の 基本構造を示す図、第2図は第1図に示す回折格 子素子3を第1図(a)に示す+Z軸方向から見 た図、第3図は光検出器5上に集光する最少錯乱 円を示す図、第4図は本発明にかかる回折格子素 子3上に干渉縞を記録する方法を示す図、第5図 は従来の光学式情報再生装置を示す図である。

図中、1 ···半導体レーザ(光源)、3 ···回折格 于素子、5 ···光検出器、7 ···対物レンズ、9 ···光 学式情報記録媒体、A ···領域、B ···領域、であ る。

> 出順人 京セラ株式会社 代理人 弁理士 銭 谷 隆(外1名)

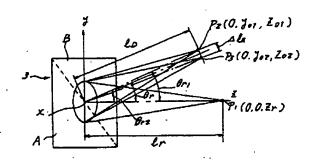
②上記実施例においては、回折格子署予3を第2図に示すY軸からα=45。傾いた直離で領域Aと領域Bに2分割したものを示したが、このY軸からの傾き角αは45。±10。の範囲であっても本発明の一応の目的は達成できる。但し、領き角αは45。±5。の範囲が最も基ましい。

③なお回折格子素子3への干渉縞の形成は、上記点光源による干渉縞の形成方法以外の例えば脊膜の蒸着、エッチング等によってレリーフを形成してもよいことは言うまでもない。

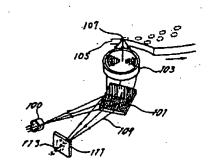
〔発明の効果〕

以上詳細に説明したように、本発明に係る光学 式情報再生装置によれば、たとえ周辺温度の変化 等によってレーザ光の被長が変動して回折角が変 化しても、フォーカス誤差信号とトラッキング誤 差信号に生じる誤差を非常に少なくすることがで きる。

また、1枚の回折格子素子に2種類の干渉縞を 形成するだけでよいので、該回折格子素子の製作 が簡単となり、コストも低減化できる。

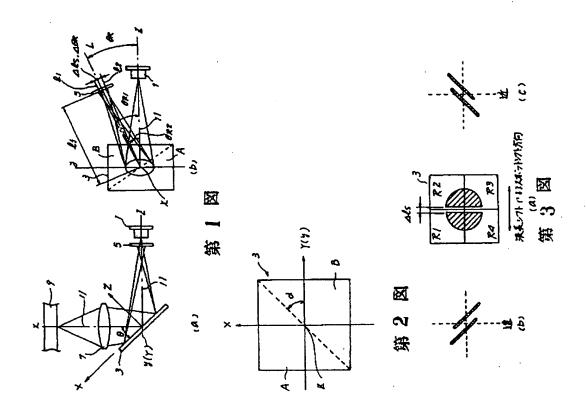


第 4 図



第5図

特開平2-179936 (6)



手続補正書(說)

特許庁長官

1.事件の表示

昭和63年特許顯第334863号

- 2.発明の名称
 - 光学式情報再生装置
- 3 . 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

名称 (663) 京セラ株式会社

代患者 安 披 飲 寿

4.代理人 〒150

住所 東京都拔谷区東2丁目20番14号 タワーホームズ氷川1001号

氏名 弁理士(B706)線 谷 隆(外1名)

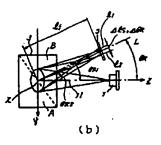
5 , 補正命令の日付 (自発)

6.補正の対象

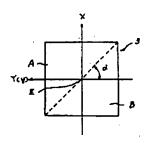
図面の第1図(b) . 終2図及び第4図

7. 補正の内容 別紙のとおり

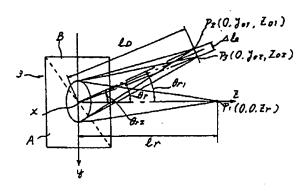




第1図



第 2 図



第 4 図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.